**Шретер, Юрий Георгиевич. Исследование оптических и электрических свойств кристаллов Si и Ge, содержащих дислокации и границы зерен : автореферат дис. ... доктора физико-математических наук : 01.04.10 / Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе.- Санкт-Петербург, 1993.- 54 с.: ил. РГБ ОД, 9 93-2/213-7**